

國立中興大學 儀器聯合說明會

Instrument meeting in NCHU

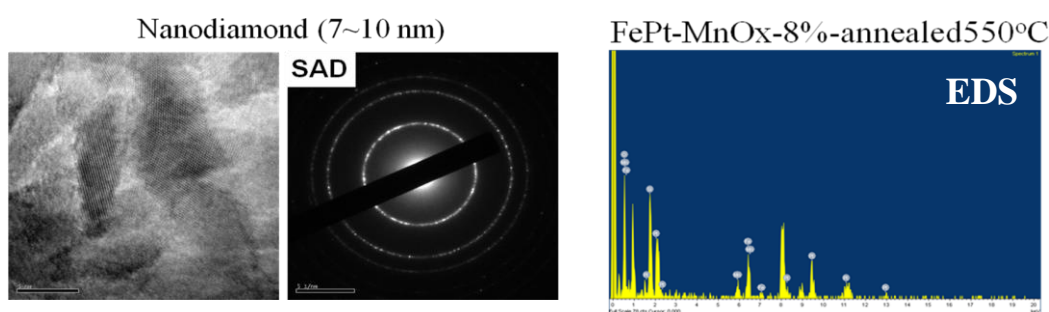
日期：105年2月24日(三)

時間	課程內容	演講者	地點
12:40-13:00	報到簽名		理學大樓 1A01
13:00-13:10	開場	能源奈米中心 主任 葉鎮宇 教授	理學大樓 1A01
13:10-14:10	高解析度穿透式電子顯微鏡(HR-TEM)說明會	捷東 洪英傑 經理	理學大樓 1A01
14:10-15:10	原子力顯微鏡(ICON)說明會	Bruker 陳彥甫 工程師	理學大樓 1A01
15:10-15:20	休息		
15:20-16:20	三次元奈米級拉曼磷光共軛雷射顯微光度計	物理系 施明智 副教授	理學大樓 1A01

高解析度穿透式電子顯微鏡

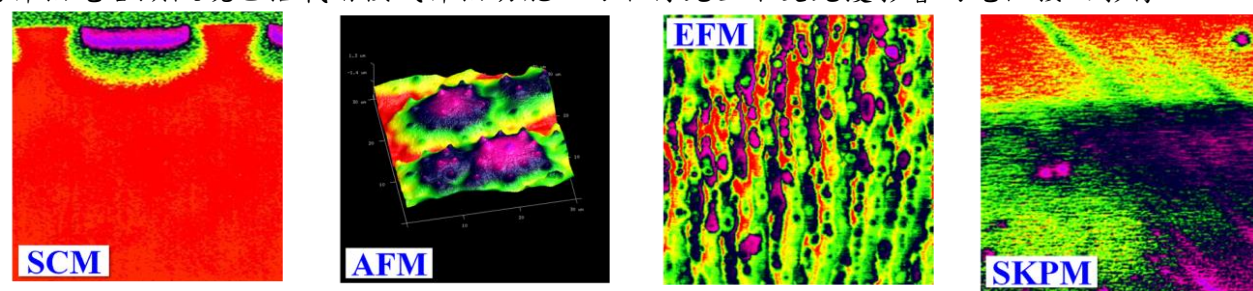


本中心之高解析度穿透式電子顯微鏡使用日本 JEOL JEM-2010 (200 kv) 型式，配備高性能六硼化鏷 (LaB₆) 電子源。服務項目包括：影像觀察 (明視野、暗視野)、微區繞射 (NBD)、收斂電子束繞射 (CBD)、微區元素分析 (EDS)、高解析數位影像處理等。在材料的微觀組織、結構鑑定與影像的處理上，能夠更正確與方便快捷。



原子力顯微鏡

本中心購置的電性掃描探針顯微鏡系統，為一具有多項優異功能的掃描探針顯微鏡，能滿足先進奈米量測分析與研究的各項基本需求，具有快速掃描、高解析度、低雜訊與高穩定性等優點，可提供材料表面奈米區域的形貌分布、電位分析、電場分析、載子分布與電流分布等各種資訊。其高靈敏度的掃描電容顯微鏡已搭載暗模式掃描功能，可取得完全不受光擾影響的電性接面影像。



三次元奈米級拉曼磷光共軛雷射顯鏡



Nanofinder® 30 為一具高感光度與高解析度的三維拉曼顯微影像分析系統，具有可同時擷取三維影像與材料分析之功能。此光學系統建立於共軛焦顯微鏡的基礎上，因同時裝載有光譜分析儀與時間相干單光子偵測器，因此分別於光譜與時間參數上提供分析材料特性之能力。Nanofinder 具三維顯微拉曼散射或螢光影像偵測，拉曼光譜分析，螢光衰減週期 (FLIM) 分析等能力，可應用於如活體細胞偵測，半導體與半導體裝置材料與應力分析，磊晶薄膜結構與成分分析，以及石墨(矽)/奈米碳管結構分析等多重領域之研究。

國立中興大學 儀器說明會報名

主辦單位：貴重儀器中心
 協辦單位：永續能源與奈米科技研究中心
 報名日期：即日起 ~ 105年2月23日下午5:00截止
 報名方式：網路報名 <http://140.120.49.119/>
 演講內容：請於 105年2月23日網頁附件自行下載
 聯絡人：(04)2284-0502#17 鄧小姐
